40 СОБСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УМЕНЬШЕНИЯ ДО БЕЗОПАСНЫХ ПРЕДЕЛОВ

Коржуев М.А., Катин И.В., Нихезина И.Ю.

ФГБУН ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН, Москва, E-mail: korzhuev@imet.ac.ru

При работе термоэлектрических преобразователей энергии (ТЭП) возникают электромагнитные поля (ЭМП), достигающие значительной величины [1-3]. Возникающие статические электрические поля E и напряжения $U = E/d = \alpha \Delta T$ (здесь d – межэлектродное расстояние, α - термо - э.д.с.), электрические токи I и магнитные поля H ТЭП определяются перепадом температуры ΔT в образцах, либо задаются схемами питания ТЭП [1]. Величины α , U, I и H определяются режимом работы ТЭП¹ и природой термоэлектрически – активных сред (ТЭАС) [2-4]. Наибольшее различие в величинах α , U, I и H наблюдается между ТЭАС диэлектриками и ТЭАС - проводниками (металлами, полупроводниками и т.п.) (табл.1) [1-4].

Таблица	1
гаолица	1

N₂	Характеристика	Диэлектрики	Проводники	
1	Носители тока	Связанные электроны и	Свободные	
		ИОНЫ	электроны	
2	Природа тока	Ток смещения, ориентации	Ток проводимости	
		диполей и т.п.		
3	Величина тока, I, А	до 10 ⁻⁶ и менее	до 1-10 и более	
		~ 1- 10 (пробой)		
4	Напряжение, U, B	до 10 ³ и более	< 10 ⁻¹	
5	Удельное сопро-	до 10 ¹⁵	~10-7	
	тивление, <i>р</i> , Ом.м	10 ¹ -10 ⁻⁴ (пробой)		
6	Термо - э.д.с. α, В/К	до 10 и более	$10^{-6} - 10^{-4}$	

Сравнительные характеристики ТЭАС – диэлектриков и проводников [4]

Для ТЭАС - диэлектриков характерны большие электрические поля E и напряжения U, при этом рабочие токи I и связанные с ними статические магнитные поля H имеют незначительную величину (табл.1). С другой стороны, в ТЭАС - проводниках величины E и напряжения U

малы, зато I и H могут достигать большой величины (табл.1). Для ТЭАС со смешанной электронно-ионной проводимостью α , U, I и H имеют промежуточные значения [4]. Целью настоящей работы было оценить характерные значения ЭМП различных ТЭАС и рассмотреть возможности их уменьшения до безопасных пределов.

Электрические поля Е. На рис.1 показаны эквивалентные цепи ТЭП - диэлектриков (а) и проводников (б). В качестве эквивалентного источника тока для диэлектриков использован перезаряжаемый конденсатор C (a), а для проводников – источник постоянного тока U (б). В цепи (б) внутреннее сопротивление r_i определяет ток короткого замыкания термопары I_{max} , а $r_i \sim U/I_{\text{max}}$ в цепи (а) - скорость разрядки С (здесь $I_{\text{max}} \sim Q/\tau_{\text{M}}$; Q = qS; q - поверхностная плотность заряда; $\tau_{\text{M}} = \varepsilon_{\text{r}} \cdot \varepsilon_0 \cdot \rho$ максвелловское время релаксации, $\varepsilon_0 = 8.85 \ 10^{-12} \ \Phi/\text{M}$ и ε_r - электрическая постоянная и относительная диэлектрическая проницаемость, *р* - удельное сопротивление материала). В случае «безобкладочных» конденсаторов С параметр r_i (рис.1а) имеет большую величину, так что «заряженные» ТЭАС – диэлектрики обычно оказываются практически безопасными для человека (рис.2а и 2б). Также безопасны для человека и ТЭАС проводники, использующие низкие рабочие напряжения U (табл.1). В результате при прикосновении к образцам ТЭАС (рис.2) оператор обычно не ощущает действия электрического тока (табл.2). ² Однако, в случае использования металлических обкладок C ($\tau_{M} \sim 10^{-18}$ с и $r_i \rightarrow 0$) поражающая способность ТЭАС – диэлектриков резко возрастает [3, 4].



Рис.1. Эквивалентные цепи ТЭП с диэлектрическими (а) и проводящими ТЭАС (б). Здесь R, R^* и r_i – сопротивления нагрузки, утечки и внутреннее ТЭП; I и I^* - токи нагрузки и утечки.

Магнитные поля Н. Из-за малости токов в ТЭАС – диэлектриках (табл.1) создаваемые ими магнитные поля H обычно пренебрежимо малы ($H < 10^{-6}$ Э). Исключение составляют процессы «зарядки»/ «разрядки» ТЭАС - диэлектриков, а также электрического пробоя образцов [1-4]. Так при исследовании процесса воздушного пробоя обычного пьезоэлемента

¹ Холостой ход (xx) – I= 0; короткое замыкание (кз) - I= I_{max} ; максимальная мощность W^{max} = $(I \cdot U)_{max}$ и кпд (Z_{max}) [2].

² При оценках полагали, что сопротивление человеческого тела $R = 10^{-4}$ Ом [3].

мы наблюдали кратковременные потоки энергии ЭМП, превышающие безопасные пределы ($P < 5 \text{ мBt/см}^2$) (рис.3) [5].



Рис.2. «Заряженные» образцы сургуча ($\tau_{M} \sim 10^5$ с, $I \sim 10^{-14}$) (а) и турмалина ($\tau_{M} \sim 10^3$ с, $I \sim 10^{-12}$ A) (б) («безобкладочные» конденсаторы, $U \sim 10^2$ - 10^3 B) и термобатарея C3-4 II под напряжением $U \sim 1B$ (I < 0,1 mA) (в).

Таблица 2

Уровни безопасности при воздействии постоянных электрических и магнитных полей на человека [5]³

Характеристика	Действующее	Проходящий	Магнитное поле,	
	напряжение U , В	ток, <i>I</i> , мА	Н, Э	
Порог чувствительности	3- 30	1 - 5	~ 0,01**	
Опасное значение	>12	20 - 30*	300- 700	
Смертельное значение	$50 - 35 \cdot 10^3$	50 - 100	Не установлено	

* «Неотпускающий» (парализующий) ток; ** - «метеочувствительные» люди



Рис.3. Разряд пьезоэлемента ($U \sim 3 \text{ кB}$, длина дуги l=3-4 мм) (1). Плотность потока энергии ЭМП в момент разряда: $2-P \ge 5 \text{ мBT/cm}^2$; $3-P < 5 \text{ мBT/cm}^2$; $X \sim 8-10 \text{ мм}$. Измеритель - тестер MS-48 M

С другой стороны, для ТЭАС - проводников имеем $I \sim 1-10^3$ А (табл.1) [1, 2]. При этом магнитные поля H в короткозамкнутых ТЭП

специальной конструкции могут достигать значительной величины (*H*.= $8I(a^2+b^2)^{1/2}/(4\pi ab) \sim 10^5$ А./ м ~ 1 кЭ) (рис.4а) [6]. Согласно [6], эффективность преобразования $I \rightarrow H$ в ТЭП при малых ΔT описывается «коэффициентом тока» $\chi = j/q = \alpha/(\rho \cdot \kappa + \alpha^2 T) = (Z/\alpha)/(1+ZT)^{-1} = Y/(1+ZT)$. (Здесь $Z = \alpha^2/\rho \cdot \kappa$ – термоэлектрическая добротность; α, ρ и κ – термо - э.д.с., электросопротивление и теплопроводность ветвей; T – температура; $Y = \alpha/\rho \cdot \kappa = Z/\alpha$ – параметр «магнитотворной» способности ТЭАС). При этом максимум χ ТЭАС - проводников достигается при более высоких концентрациях носителей тока *n* в образцах, чем Z_{max} и W_{max} (рис. 36). В табл.3 приведены коэффициенты Y и χ различных металлов и вырожденных полупроводников. Из табл.3 видно, что «магнитотворная» способность ряда полуметаллов и сплавов действительно оказывается большей, чем для полупроводников с высокими Z.



Рис.4. а - Конструкция ТЭП для получения сильных магнитных полей [11]. б - термоэлектрические характеристики проводящих ТЭАС в зависимости от концентрации носителей тока *n*. 1 - α ; 2 - Z= $\alpha^2/\rho \kappa$; 3 - W= α^2/ρ ; 4 - Y= $\alpha/\rho \kappa$; 5 - ρ^{-1} ; 6 - $\kappa = \kappa_L + \kappa_c$; 7 - κ_h - теплопроводность кристаллической решетки; κ_e – электронная составляющая теплопроводности.

Таблица 3

Коэффициенты «магнитотворной» способности ТЭАС – проводников (Т= 300 К							
Материал	Cu	Константан	Bi	Копель	Bi ₂ Te ₃	GeTe	Si _{0,7} Ge _{0,3}
ZT	0,0001	0,03	0,19	0,04	0,9	0,07	0,09
<i>Y</i> , 1/B	0,24	6,2	7,9	10	14	4	2,5
χ, 1/ B	0,24	6,2	6, 6	10	7	3,7	2,3

На рис.5 показана термопара Ві – Си, разработанная нами для демонстрации возможности получения магнитных полей $H \sim H_3$ за счет тепла тела человека [4]. Электрические сопротивления плеч термопары составляли $R_{\rm Cu}$ = 0,00016 Ом, $R_{\rm Bi}$ = 0,00001 Ом, термо-э.д.с. α = 80 мкВ/ К, площадь рамки S= $a \cdot b$ = 2x5 см². При нагреве стыка термопары от внешнего источника на $\Delta T_0 \sim 12$ К (здесь ΔT_0 – разность температур воздуха и тела

³ Деструктивная работа тока для организма человека составляет $A \ge 100$ - 150 Дж, время полной деструкции тканей под действием импульсных магнитных полей амплитудой $H \sim 4 - 40$ A/м (скважность 50- 70 мкс, время экспозиции ~ 1,5- 3 часа в сутки) - 3 - 4 месяца (опыты на животных) [5].

⁴ Магнитное поле Земли составляет $H_3 = 0$, 65; ~0,5 и 0, 35 Э на магнитном полюсе, в районе Москвы и магнитном экваторе соответственно (1Э = 79, 6 А/м).

человека) магнитная стрелка, первоначально ориентированная по направлению H_3 , поворачивалась на угол $a^0 \sim 55^0$, при этом магнитное поле в центре контура (рис.5а) достигало $H \sim H_3$ ·tg $a^0 \sim 0.7 \ \Im \sim 1.4 \cdot H_3 > H_3$. Однако при нагреве термопары рукой получали существенно меньшие значения $a^0 \sim 30^0$, $\Delta T \sim \Delta T_0 \cdot \xi_{\pi\pi} / [(\xi_{\pi\pi} + \xi_{\kappa \sigma \pi}) \cdot A] \sim 4 \text{ K и } H \sim 0.3 \ \Im \sim 0.6 \ H_3$, что определялось тепловыми потерями, связанными с высоким тепловым сопротивлением кожи человека ($\xi_{\kappa \sigma \pi} / S \sim 440 \text{ cm}^2 \cdot \text{K} / \text{Bt}$) [7]. (Здесь $\xi_{\pi\pi}$ и $\xi_{\kappa \sigma \pi}$ – теплопроводности ветвей ТЭП и кожи человека, $A \sim 1.2$ – коэффициент, описывающий потери на стыках за счет выделения тепла Пельтье и Джоуля). Результаты опыта (рис.5а) показывают, что при размещении ТЭП близости тела человека (см., например, б и в, рис.5) необходимо принимать особые меры предосторожности.



Рис.5. а - Короткозамкнутая термопара Bi – Си для получения магнитных полей за счет тепла тела человека. [3] .б – часы с термоэлектрическим источником питания, в – автомобильное кресло с термоэлектрическим кондиционером [7].

Паразитные переменные электромагнитные поля. При исследовании работы ТЭП нами обнаружены паразитные переменные электромагнитные поля (ПЭМП) (50 Гц), окружающие в ряде случаев модули и подводящие провода (1-3, рис.6). Эти ПЭМП уже на расстояниях X < 6- 15 см от ТЭП превышали предельно допустимые значения по плотности потока энергии P > 5 мВт/см² (2, 3, рис.6). ПЭМП наблюдались при использовании источников питания с двухпроводными линиями (на входе и/или на выходе), которые не обеспечивали необходимой фильтрации напряжения. Причиной появления ПЭМП является перезаряжающаяся емкость подводящих проводов ((+) и (-), г, рис.6). Нами замечено, что эти ПЭМП полностью исчезают при питании ТЭП от трех - проводных линий (д, рис.6)), либо от аккумуляторов. Другие методы борьбы с ЭМП, позволяющие уменьшить поражающие факторы ТЭП до безопасных пределов, показаны на рис.6 (а - 3).



Рис.6. Переменное ЭМП вокруг работающего модуля C5-1 II (1) (Области: 2 – $P \ge 5 \text{ MBT/cm}^2$; 3 – $P < 5 \text{ MBT/cm}^2$; X = 6- 15 см, измеритель - тестер MS-48 M) и схемы компенсации ЭМП ТЭП: а, б – бифилярное включение ветвей; в, 3 – защитное экранирование и заземление; г - трех - проводная линия питания.

Выводы

1. Параметры термоэлектрических преобразователей (ТЭП), использующих ТЭАС - диэлектрики и ТЭАС - проводники, существенно различаются; для первых характерны большие электрические поля *E* и напряжения *U*, для вторых - большие токи *I* и магнитные поля *H*.

2. Во всех случаях возникает необходимость защиты от вредных воздействий ЭМП ТЭП, в особенности, при размещении ТЭП вблизи электронных схем и тела человека.

3. Основными методами защиты от ЭМП ТЭП являются: удаление потребителей на безопасное расстояние, экранирование и заземление ТЭП, использование бифилярных цепей и трех - проводных линий питания.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Поздняков Б. С, Коптелов Е. А. Термоэлектрическая энергетика. М., Атомиздат, 1974, 264 с.
- 2. Манасян Ю.Г. Судовые термоэлектрические устройства и установки Л.: Судостроение. 1968. 284 р.
- 3. Най Дж. Физические свойства кристаллов. М. Мир. 1967, 386 с.
- 4. Korzhuev M.A., Katin I.V. Fizica si Tehn. Moderne, т. 10. №3-4, 2012. p.75-92.
- 5. Манойлов В.Е. Основы электробезопасности. Л.: Энергоатомизд. 1991. 480 с.
- 6. Плеханов С.И., Тереков А.Я. Вклад члена- корреспондента РАН Н.С. Лидоренко в развитие термоэлектричества в России. В сб.: Николай Степанович Лидоренко. М., ОАО НПО «Квант», 2011, с.3- 25.
- Leonov V., Yullers R.J.M. Thermorlrctric generators on Living Beings. Proc. 5th European Conf. Thermoelectrics (ECT- 2007). Odessa, Thermion. 2007. p. 47-52.